**全新QUANTiC™ 增量式光學尺**

Renishaw是全球量測產業的領導廠商。此次針對線性軸所推出的全新QUANTiC™ 增量式光學尺系列產品，不僅具備極大的安裝公差，工作速度更可達到 24 m/s。QUANTiC™ 光學尺系列產品可直接從讀頭產生數位訊號輸出，因此無須額外連接外部介面，進而減少佔用空間。這個開創性的技術最早應用於 Renishaw 的先進 VIONiC™ 光學尺上。

在 OEM 應用上，機器組裝時間最為關鍵，而減少零組件的安裝時間就能縮短前置作業所需的時間，進而提高獲利能力。QUANTiC 光學尺以此為設計理念，不僅具備 Renishaw 相關系列產品最大的安裝公差及優異的抗污能力，還可另外搭配進階診斷工具 (ADT)，以便進行遠端校正和進階診斷。

QUANTiC 光學尺系列產品採用 40 µm 柵距，由於 Renishaw 光學尺獨特的光學設計，此柵距可達成更大的安裝公差和更高的工作速度。例如，讀頭安裝高度和偏角公差現在分別為 ±0.2 mm 及 ±0.9⁰。光學尺型號包括 RTLC40和與其對應的導軌 (*FASTRACK™*) 及自黏式 RTLC40-S，兩者均讓光學尺不受基材影響而獨立膨脹，藉此簡化熱膨脹的誤差補償。

QUANTiC 光學尺系統具備多項先進的設計特色，防塵和防污染的能力十分優異。QUANTiC 讀頭使用 Renishaw 廣受好評的過濾光學鏡組，能淡化污染物對刻度週期的影響，並且有效篩選非週期特徵，例如污染物。透過多種電子訊號處理演算法，例如自動增益控制 (AGC)、自動偏置控制 (AOC) 和自動平衡控制 (ABC) 等，進一步強化測量訊號。QUANTiC 光學尺使用全新的感測器，提供第三層訊號過濾功能，有助於杜絕因光學尺上的污染物而引起的非諧波訊號頻率。這些訊號調節功能相互結合，可確保提供低細分誤差 (SDE)，以及在受污染影響情況下將訊號變異控制在最低情況。

進階診斷工具 (ADT) 結合了 ADTi-100 硬體和 ADT View 軟體元件，能進一步支援簡化 QUANTiC 的安裝和校準。特性與優點包括：遠端監控、訊號大小的視覺與聽覺指示、限位開關與讀頭柵距、DRO 輸出、利薩圓圖形輸出，並可以多種常見檔案格式儲存資料。

QUANTiC 光學尺有助於加快量產生產線的速度，為 OEM 客戶節省可觀的時間和成本。QUANTiC 產品系列榮獲 CE 認證，並由 Renishaw通過 ISO 9001:2008 認證的嚴格品管製程做製造。此外，與所有 Renishaw 光學尺一樣，QUANTiC 亦獲得世界各地的銷售和支援，能迅速回應客戶的需求。

如需 Renishaw 編碼器的詳細資訊，請造訪 [www.renishaw.com.tw/QUANTiC](http://www.renishaw.com.tw/quantic)

**-結束-**